

# 高速/低ノイズの ADCにより、飛行時間型 質量分析計の性能を高める

著者: Guixue (Glen) Bu、システム設計エンジニア

## 概要

飛行時間型質量分析計(TOF MS: Time of Flight Mass Spectrometry)は、試料に含まれる分子の種類を特定するた めに使われる装置です。特に、臨床微生物検査の分野では、細 菌の種類を同定するための装置として極めて重要な役割を果た しています。多くの場合、TOF MSでは高速/低ノイズのA/ Dコンバータ(ADC)が心臓部として機能することになりま す。本稿では、まずTOF MSの重要なパラメータに注目しな がら、その基本を押さえます。続いて、TOF MSのパラメータ とADCの仕様の関係について詳しく解説します。更に、TOF MSに最適なMxFE<sup>®</sup>(ミックスド・シグナル・フロント・エンド) 製品を紹介します。高速/低ノイズのADCを内蔵するMxFE 製品を利用すれば、質量精度、質量分解能、感度など、TOF MSの性能を大幅に高めることができます。

### TOF MSの基本

質量分析法(MS: Mass Spectrometry)とは、分子量(分子の 質量)に基づいて試料に含まれる既知/未知の分子を特定する手 法のことです。質量分析法では、まずフラグメンテーション(開 裂)の有無にかかわらず、試料内の元素や分子をイオン化します。 得られた気体状のイオンを質量分析器で分離し、質量電荷比(m/ z比)と相対存在量に基づいて元素や分子の特性を明らかにしま す。より具体的な表現で説明すると、質量スペクトルに現れるパ ルスの位置とパルスの振幅を算出することによって、分子の種類 や量を特定するということになります。

質量分析計は、大きく分けて3つのコンポーネントから成ります。
1つ目は、測定の対象となる試料から気体状のイオンを生成する
イオン源です。2つ目は、m/z比によってイオンを分離する質量
分析器です。そして3つ目が、イオンと各イオン種の相対存在量
を検出するイオン検出器です。イオン検出器の出力に対してはコ
ンディショニングの処理とA/D変換の処理が適用されます。そ
れによって得られたデジタル・データを基にして質量スペクトル
が生成されます。実際の質量分析器には、様々な種類があります。
m/z比の値が異なるイオンを分離するための方式に違いがあるか
らです<sup>1</sup>。図1に、質量分析計の実現形態の例を2つ示しました。
上側に示したのは四重極型の質量分析計です。そして下側に示し
たのが本稿のテーマであるTOF MSです。







TOF MSにおけるイオン化は短時間で行われます。生成された イオンは静電場によって加速されます。各イオンはm/z比の値 に関わらず同じ量の運動エネルギーを持ちますが、速度に違いが 現れます。加速されたイオンは電場のないドリフト・パスを通過 し、それぞれに異なる飛行時間でイオン検出器に到達します。つ まり、軽いイオンは重いイオンよりも先に到達するといった具合 です(図2)。実際には、m/z比が同じイオンの集合の飛行時間 は、パルスを形成する形で分散/分布します。そのパルスの幅 は、加速領域における初期の空間分布とエネルギー(または速度) の違いによって、数百ピコ秒程度になることがあります。各パル スは、複数の独立したイオンの到達というイベントに対応する信 号の総和に相当します。多くの場合、それらのパルスは半値全幅 (FWHM:Full Width at Half Maximum) というパラメータに よって特徴づけられます。



マイクロチャネル・プレート (MCP: MicroChannel Plate) 検 出器などの場合、入射イオンを検出してパルス電流を生成しま す。その電流の値は、時間 - デジタル変換器 (TDC: Time-to-Digital Converter) または高速ADCによって記録されます。 TDCを使えば、数ピコ秒のレベルの極めて高速な処理を実現で きます。一方で、パルスの振幅を記録するためのダイナミック・ レンジが限られています。それに対し、高速ADCであれば、10 ビット、12ビット、あるいはそれ以上の分解能と2GSPS以上の 変換レートを実現できます。そして、パルスのタイミングと振幅 の両方を正確に記録することが可能です。つまり、多くのTOF MSでは、ADCがシステムの性能を決定づける重要な要素になり ます。

#### TOF MSの特徴

TOF MSは、1990年代以降に大きな関心を集めるようになり ました。その契機となったのは、マトリックス支援レーザ脱離 イオン化 (MALDI: Matrix-assisted Laser Desorption and Ionization) 技術が発明/商用化されたことです<sup>2</sup>。MALDI技術 は、数百ピコ秒から数ナノ秒の紫外線レーザ・パルスによって、 マトリックス分子(通常は有機酸)をイオン化すると同時に、試 料の分子を気化させるというものです。気相において、マトリッ クス分子はプロトン(陽子)を試料の分子に対して送出し、試 料の分子にプロトンを付加してイオン化します。マトリックスは レーザ・エネルギーのほとんどを吸収するので、試料中の分子は フラグメント化したり、分解されたりすることなくその完全性を 維持します。このような理由から、MALDI技術は、生体高分子 の分析で使用するイオン化の手法として最も有力なものとなりま した。しかも、MALDIとTOF MSを結び付けるのは難しくあり ません。TOF MSは、質量の範囲に制限がなく、高感度、高スルー プットです。そのため、高分子を分析の対象とすることが多い生 物医学の研究、創薬、臨床応用などに不可欠なツールとなってい ます。

MALDI技術を採用したTOF MS(以下、MALDI-TOF MS)で は、分析時間をわずか4時間に抑えられます。それに対し、従来 の技術や他の新技術を使用した場合、分析時間は72時間以上に も達します。つまり、MALDI-TOF MSを採用すれば明白なメリッ トが得られるということです。そのため、MALDI-TOF MSは、 臨床分野で細菌の同定に使用する装置として不可欠なものになっ ています<sup>3</sup>。検査にかかる時間の長短は、細菌による感染症に苦 しむ患者の治療と予後に対して非常に大きな影響を及ぼします。 MALDI-TOF MSの長所はそれだけではありません。例えば、試 料の作成が容易であること、運用コストを抑えられること、希少 な細菌を同定できる可能性があることなど、様々なメリットを享 受することができます。抗菌薬に対する耐性は、世界中の人々の 健康に対する大きな脅威になります。そのため、ポイント・オブ・ ケア向けの装置としてMALDI-TOF MSを活用することが1つの トレンドになっています<sup>4</sup>。

# TOF MSの主要なパラメータ

ここまでに説明したように、TOF MSを使用すれば、試料中に存 在する様々な分子を定量化することができます。その能力は、多 くの要因によって左右されます。例えば、試料をイオン化する方 法や、システムの構成、イオンを加速して検出器へ導く電場のタ イミング性能、検出器の効率、信号のデジタル化を担うデバイス などに依存することになります。TOF MSには様々な仕様項目が あります。それらのうち、本稿では信号のデジタル化に関連する 仕様に注目することにします。具体的には、質量範囲、質量精度、 質量分解能、繰り返しレート (repetition rate)、感度などを取 り上げることにします。

質量範囲とは、試料に含まれる分子の分子量の範囲のことです。 これは、加速電圧、フライト・チューブの長さ、サンプリング・ レート、繰り返しレートなど、いくつかの要因に関連します。質 量範囲の要件は、アプリケーションによって異なります。例えば、 MALDI-TOF MSによって細菌を同定する場合、2000Da(ダル トン)~2万Daの質量範囲でリボソーム・マーカの測定を実施し ます。

TOF MSでは、飛行時間に基づいて質量を計算します。そのため、 TOF MSにおける質量精度は、主としてパルスの時間の測定精度 によって決まります。実際には、各パルスの到達時間は、パルス をガウス関数にフィッティングし、ピークを見つけることによっ て算出します。個々のパルスのサンプル数は、ADCのサンプリ ング・レートに依存します。従って、ADCのサンプリング・レー トはパルスのフィッティングにおいて非常に重要な仕様になりま す。

質量分解能とは、スペクトル上の隣接する2つのパルスを識別す るために必要な最小間隔のことです。多くの場合、イオンの質量 とそれに対応するパルスの幅の比として定義されます。また、一 般的にはパルスの幅はFWHMによって定義されます。パルスの 幅が狭くなるほど質量分解能は高くなります。つまり、分子量の 近い2つのイオンの集合をより的確に区別できるようになるとい うことです。質量分解能は、直交加速とリフレクトロンによって 大幅に高めることができます。また、この重要な仕様には、ADC のサンプリング・レートとノイズ性能も影響を及ぼします。 TOF MSにおいて、質量スペクトルは多くの繰り返し処理で得ら れた信号の総和として取得します。つまり、イオン化、加速、ド リフト、イオンの検出、デジタル化のプロセスを1つしか含まな い単一のトランジェントによって取得するわけではありません。 分子量と濃度が異なる複数の分子を含む試料を扱う場合、単一の イオン化を行っただけでは、対象とする全分子のイオンの情報も、 その濃度に比例した比率も得られない可能性があります。そうし たサンプリング誤差を低減し、S/N比 (Signal to Noise Ratio) を向上させるためには、加算処理が効果的かつ実用的なアプロー チとなります。従って、繰り返しレートは、TOF MSのS/N比 とスループットに関連する重要かつ実用的な仕様として扱われま す。最新のTOF MSでは、1kHz以上でスキャンを実施すること ができます。つまり、各トランジェントの時間は1ミリ秒以下と いうことになります。ADCのサンプリング・レートが高ければ、 各トランジェントの持続時間が短くなり、繰り返しレートを高め ることが可能になります。

TOF MSの感度とは、試料中の最低濃度の分子を検出する能力 のことです。この能力は、多くの要因によって総合的に決まりま す。要因の例としては、化学的なバックグラウンド・ノイズ、対 象とするすべての分子の濃度範囲、検出器とADCのノイズ指数 とダイナミック・レンジ、最終的な質量スペクトルを得るために 加算されるトランジェントの数などが挙げられます。システムの 感度は、ボトルネックとなる要因を特定したり、上記の要因のバ ランスをとったりすることで最適化することができます。

#### TOF MSにはどのような ADC が必要なのか?

TOF MSの性能を高めるためには、低ノイズ、高速のADCを採用することが非常に重要です。先述したように、TOF MSにおい ては、時間の測定精度とシステムのノイズ・レベルが重要な仕様 になります。システムのノイズ・レベルについては、繰り返しに よって得た測定値を加算するということが対処策になります。し かし、時間の測定精度はADCのサンプリング・レートとアパー チャ・ジッタによって決まります。直交加速とリフレクトロンを 採用したTOF MSでは、パルスが数百ピコ秒程度に狭くなる可 能性があります。その場合、サンプリング・レートが5GSPSで あったとしても、個々のパルスに対応するサンプルの数はわずか 数個にしかなりません。サンプルをガウス関数にフィッティング させる場合、パルスのピークを求めるためにはそれぞれのサンプ ルが非常に重要な意味を持ちます。したがって、ADCについて はサンプリング・レートとアパーチャ・ジッタが重要な仕様にな ります。

TOF MSの感度は、システムのノイズ・レベルによって決まり ます。これについては、繰り返し測定の結果を加算することで改 善できます。但し、繰り返しの回数は装置のスループットを制限 する要因になります。より少ない繰り返しによって目標とする感 度を達成するためには、ADCのノイズ性能が重要です。ただ、 ADCの仕様については注意すべき点があります。例えば、ADC のS/N比はその分解能に比例すると理解している方は少なくない でしょう。サンプリング・レートが1GSPS以上のADCは、パイ プライン型のアーキテクチャを採用して実現されていることが多 いはずです。そうしたADCには、有効ビット数 (ENOB) やノ イズ密度、ノイズ指数、S/N比といった仕様が存在します。パイ プライン型は広く採用されていますが、そうすれば分解能(ビッ ト数)に基づく理想的な性能が得られるというわけではありませ ん。パイプライン型のADCには、ノイズの原因となるいくつか の欠点が存在します。例えば、誤差を低減するためには、ゲイン が高く、帯域幅の広いオペアンプが必要になります。また、コン デンサのミスマッチや、フロント・エンドのサンプル&ホールド 回路やオペアンプ回路の消費電力なども誤差源になる可能性があ ります<sup>5</sup>。ENOBは、入力周波数とサンプリング・レートに依存し、 信号/ノイズ+歪み (SINAD)を基にして計算します。例えば、 MxFE製品である「AD9081」は、分解能が12ビットのADCを 内蔵しています。そのENOBは、入力周波数が4500MHz、サン プリング・レートが4GSPSの場合、8ビットのレベルになります。 ここで注意が必要なのは、ENOBは、ADCのノイズ性能を表す ための適切な指標ではないということです。それに対し、ノイズ 密度を指標とすれば、実際のノイズ・レベルをより適切に判断す ることができます。実際、ガウス・パルスを使用した評価を行え ば、ADCのノイズ性能を的確に把握することが可能になります。 その結果、TOF MSの感度について、どのような性能が得られる のかを適切に推定/判断できるようになります。

### 低ノイズで高速なADCの評価

アナログ・デバイセズのMxFEは、RF対応のADCとDAC(D/ Aコンバータ)、デジタル信号処理用の回路、マルチチップの同 期を実現するためのクロック回路/フェーズ・ロック・ループ (PLL) 回路などを統合した高性能の製品です。MxFE製品の中に は、高速ADCだけを内蔵したものもあります。以下では、ADC とDACの両方を内蔵する「AD9082」の評価結果を示します(図 3)。その評価では、同ICが内蔵するDACを使用して、ガウス・ パルス列を生成することにしました。具体的には、同ICが内蔵 するデジタル・スケーリング機能と外付けのアッテネータを組み 合わせて振幅を制御し、FWHMが0.5ナノ秒という狭いパルス を実現します。一般に、ADCの特性評価にはシングルトーンの 信号が使用されます。そうした信号と比べれば、ガウス・パルス は質量スペクトルの信号にはるかに近いものだと言えます。信号 のデジタル化を行うために、AD9082が内蔵する2つのADCの チャンネルを次のように設定しました。まず、チャンネル1(CH1) については、外付けアッテネータの設定を変化させることによっ て、飽和または減衰させた様々な振幅が得られるようにしました。 一方、チャンネル2(CH2)は、飽和させることなくフルスケー ル (FS) の90%を超える信号強度が得られるように設定しまし た。このチャンネルはリファレンスとして使用します。サンプリ ング・レートは、各パルスに対して十分な数のサンプルを得るた めに6GSPSに設定しました。

ADC9082	
<b>DAC</b> デジタル・ スケーリング	
СН1	
ADC	
CH2	
ADC	

小の 外付けアッテネータ

図 3. AD9082のブロック図。 同ICが内蔵する高速 ADCを評価するための構成を示しました。 本稿では、以下の3種類の評価を実施しました。

- 減衰と飽和のテスト:リファレンスとして使用する CH2 は、 7dB に固定したアッテネータのペアと組み合わせる。CH1 は、 減衰を実現するために、8dB、9dB、10dB のアッテネータの ペアを適用する。また、CH1 については、飽和を実現するた めに 3dB、1dB のアッテネータのペアも適用する
- 最大 20dBの減衰による微弱信号の測定: CH2 には -16dBFSCのスケーリングを施し、リファレンスとしてDAC の出力に直接接続する。CH1 は、FS の 32% 未満の信号を実現するために 10dBのアッテネータのペアを適用する。また、 CH1 は FS の 10% 未満の信号を実現するために 20dBのアッ テネータのペアも適用する
- ノイズの測定: CH2 はリファレンスとして使用するために、 7dB に固定したアッテネータのペアを適用する。CH1 には 50Ωの終端抵抗を適用する

それぞれの評価では、10マイクロ秒以上にわたってデータを取得しました。また、再現性を確認するためにデータ収集を10回繰り返しました。データのプロットと解析にはMATLAB®を使用しました。10回の繰り返しについては、テスト・ケースごとに位置合わせをしてプロットを行いました。

図4に示したのは、CH1をCH2より3dB低く設定し、単一のパルスを使用した場合の測定結果です。両チャンネルにおいて、10回の繰り返しを行った結果はきれいに重なっており、データ収集において高い再現性が得られていることがわかります。







図6.入力に10dBと20dBの減衰を適用した場合の結果

AD9082のADCは、過負荷に対する保護回路を備えています。 その機能は、入力信号の振幅が上限を超えると作動します。そう すると、パルスの立下がり部に回復テール (recovery tail) が生 じることが多くなります。つまり、FSでクリップしたピークと回 復テールが現れることになります。回復テールを短くするのは、 TOF MSにより正確な時間測定 (つまりは質量の測定)を行う上 で重要なことです。図5に示したのは、飽和(最大6dB)または 減衰が生じる5つのケースに対応したプロットです。6dBの飽和 という条件において、回復テールは0.4ナノ秒未満に抑えられて います。つまり、保護回路が作動した場合でも、回復テールの広 がりは最小限に抑えられるということが示唆されています。

図6は、微弱な入力信号に対するADCの性能を示したものです。 ご覧のように、10dB、20dBの減衰を施した場合の信号を取得 しています。FSの10%、つまり20dBの減衰を施した場合でも、 信号のきれいなトレースが確認できます。このことは、ADCに 起因するノイズが最小限に抑えられていることを示唆しています。



図7に示したのは、ADCのノイズ・フロアを測定した結果です。 CH1は50Ωの終端抵抗に接続し、CH2はFSの90%よりも高い 値に維持しました。

図8は、ノイズのデータを分析した結果です。ご覧のように、 ヒストグラムをプロットし、その標準偏差(SD:Standard Deviation)を計算しました。このケースのSDは0.0025であり、 FSにおけるS/N比が52dBであることが示唆されています。 続いて、時間の測定精度とノイズ性能を更に定量化することを試 みました。それに向けて、30ナノ秒のウィンドウの中央にピーク が現れるよう各パルスを分割しました。その後、各パルスをガウ ス・モデルにフィッティングし、そのFWHMを測定しました。 ノイズの計算を行う際のベースラインとしては、30ナノ秒のウィ ンドウの両側に位置する12ナノ秒のデータを使用しました。つ まり、合計で24ナノ秒のデータを使用したということです。



図9. FSの10%の信号を入力して取得したデータ全体のプロット(左)と、 ガウス・フィッティングと分割したベースラインを適用して取得した単一のパルスの拡大図(右)

#### 表1.FSの10%の信号を入力した場合のFWHMとS/N比

CH番号	FWHM(ナノ秒)		S/N比(dB)	
	平均	SD	平均	SD
CH1 (20dB)	0.6722	0.0141	32.07	0.468
CH2 (0dB)	0.6657	0.0056	40.98	0.203

#### 表2.FWHMとS/N比の測定/計算結果

テスト・ケース	FWHM(ナノ秒)、CH1/CH2		S/N比(dB)、CH1/CH2	
	平均	SD	平均	SD
CH1=8dB, CH2=7dB	0.6543/0.6531	0.0050/0.0028	46.21/47.28	0.275/0.363
CH1=9dB, CH2=7dB	0.6656/0.6532	0.0037/0.0024	46.24/47.22	0.408/0.439
CH1=10dB, CH2=7dB	0.6549/0.6520	0.0028/0.0024	47.44/47.05	0.587/0.273
CH1=10dB, CH2=0dB	0.6708/0.6652	0.0075/0.0044	41.72/41.02	0.556/0.248
CH1=20dB, CH2=0dB	0.6722/0.6657	0.0141/0.0056	32.07/40.98	0.468/0.203

図9(左)は、FSの10%の信号を入力して取得したデータ全体 のプロットです。一方、同(右)は、ガウス・フィッティングと、 分割したベースラインを適用して取得した単一のパルスの拡大図 です。表1は、FWHMの測定値(平均値とSD)、S/N比の計算 値(平均値とSD)についてまとめたものです。

続いて、入力を1dBから20dBまで減衰させ、全テスト・ケースのFWHMとS/N比の値を測定/計算しました。表2に示した結果は、様々な入力振幅にわたり、FWHMの一貫性を保ちつつ正確な時間測定を実施できることを示唆しています。

# まとめ

MALDI-TOF MSは、臨床微生物の検査室において標準的な装置 として活用されています。一方で、パーソナライズされた医療の 確立に向け、プロテオミクスに対する関心が高まっています。こ のような状況にあることから、細菌の同定を可能にする TOF MS は、今後数十年間にわたり、ヘルスケア分野で急速な成長を続け ると予想されています。TOF MSを使用すれば、広範な分子量を 対象として完全な分子を測定することができます。そのため、生 物医学、創薬、食の安全、環境の監視といった分野の用途でも幅 広く活用されています。

本稿で例にとったように、最新のADC製品は、優れたノイズ性 能と高速なサンプリング・レートを達成しています。サンプリン グ・レートについて言えば、現世代のTOF MSで使われている ADCと比べて3倍から6倍も高速です。そのため、低ノイズで高 速の最新ADCは、次世代の高性能TOF MSにとって重要な要素 になります。サンプリング・レートが高ければ、フライト・チュー ブを短縮し、真空システムの負担を軽減することができます。そ の結果、性能を犠牲にすることなくTOF MSの設置面積を削減 することが可能になります。設置面積を抑えられるというのは、 ポイント・オブ・ケアをはじめとする様々な分野の用途にとって 重要なことです。 本稿では、AD9082の評価結果を紹介しました。ただ、このよう な評価には限界があります。例えば、振幅の小さい入力信号(FS の1%、40dBの減衰など)を使用したい場合には外付けのアッ テネータが必要になります。ただ、その入手可能性はある程度限 られています。また、インピーダンス・ミスマッチが原因となり、 データには反射の影響が及びます。加えて、本稿で紹介した評価 は、電磁干渉を避けるためのシールドを使用することなく、開放 された空間で実施しました。各テストで得られたS/N比の値は、 実際の値よりも低くなっています。ノイズの計算において、イン ピーダンス・ミスマッチが原因で生じるベースラインへの反射の 影響を除去できなかったからです。

アナログ・デバイセズは、AD9082の評価に向けて「AD9082 評価用ボード」や「分析 | 制御 | 評価用 (ACE) ソフトウェア」 も提供しています。これらを使用すれば、より集中的なテストを 実施することができます。また、ライブ・デモによる詳細な説 明をご覧いただけば、評価システムのセット・アップも容易に行 えるはずです。MxFEのサンプルを使用してプロトタイピングを 実施する際には、経験豊富なアプリケーション・チームからのサ ポートを得ることが可能です。

本稿で紹介したFWHMとS/N比の値は、MxFEのADCを使用 することにより、優れた時間精度とノイズ性能が得られることを 実証しています。MxFE製品としては、最大10GSPSのサンプリ ング・レートを実現するものが提供されています。それを採用す れば、より優れた質量精度、質量分解能、感度を備える次世代の TOF MSを、設置面積を抑えた形で設計することができます。 しかも、設計に対しては高い柔軟性がもたらされます。MxFEの ADCは、電源IC、クロック生成IC、ドライバICといった製品群 によってサポートされています。それらも活用すれば、シームレ スなシステム統合と最適化を実現できます。

#### 参考資料

<sup>1</sup> Jurgen H. Gross [Mass Spectrometry: A Textbook、3rd Edition (マススペクトロメトリー 原書3版)] Springer、2017 年

<sup>2</sup> Eva Torres-Sangiao、Cristina Leal Rodriguez、Carlos Garcia-Riestra [Application and Perspectives of MALDI-TOF Mass Spectrometry in Clinical Microbiology Laboratories (臨床微生物検査室におけるMALDI-TOF 質量分 析の用途と展望)] Microorganisms、Vol. 9、2021年 <sup>3</sup> Mohammad Y. Ashfaq、Dana A. Da'na、Mohammad A. Al-Ghouti [Application of MALDI-TOF MS for Identification of Environmental Bacteria: A Review (環境微生物の同定 におけるMALDI-TOF MSの活用:レビュー)] Journal of Environmental Management、Vol. 305、2022年

<sup>4</sup> E. Chabriere、H. Bassène, M. Drancourt、C. Sokhna [MALDI-TOF MS and Point of Care Are Disruptive Diagnostic Tools in Africa (アフリカで革新的な診断ツール として機能するMALDI-TOFとポイント・オブ・ケア)] New Microbe and New Infections、Vol. 26、2018年

<sup>5</sup> Chun C. Lee [Dissertation: Improving Accuracy and Energy Efficiency of Pipeline Analog to Digital Converters (パイプライン型A/Dコンバータの精度とエネルギー効率の向 上)] The University of Michigan、2010年

#### 著者について

Guixue (Glen) Buは、アナログ・デバイセズのシステム 設計/アーキテクチャ・エンジニアです。2018年9月に入 社。計装システム・ソリューション・グループで、科学計測 分野の機器/アプリケーションに関する研究開発に携わっ ています。中国の清華大学で医用生体工学の学士号を取 得。パデュー大学で同分野の修士号と博士号を取得してい ます。

# EngineerZone<sup>®</sup> オンライン・サポート・コミュニティ

アナログ・デバイセズのオンライン・サポート・コミュ ニティに参加すれば、各種の分野を専門とする技術者と の連携を図ることができます。難易度の高い設計上の問 題について問い合わせを行ったり、FAQを参照したり、 ディスカッションに参加したりすることが可能です。

# **ADI** EngineerZone<sup>\*\*</sup>

SUPPORT COMMUNITY

Visit ez.analog.com

\*英語版技術記事はこちらよりご覧いただけます。



# アナログ・デバイセズ株式会社

お住いの地域の本社、販売代理店などの情報は、analog com/jp/contact をご覧ください。

オンラインサポートコミュニティEngineerZoneでは、アナ ログ・デバイセズのエキスパートへの質問、FAQの閲覧がで きます。 ©2023 Analog Devices, Inc. All rights reserved. 本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。 Ahead of What's Possibleはアナログ・デバイセズの商標です。 VISIT ANALOG.COM/JP